

PRESSEMITTEILUNG

JPK Instruments stellt das weltweit flexibelste Rasterkraftmikroskop vor, das NanoWizard® 4 NanoScience AFM

Berlin, 16. Dezember 2015: JPK Instruments, ein weltweit führender Hersteller von Nanoanalytik-Instrumenten für den "Life Sciences"- und "Soft Matter"-Bereich, stellt das NanoWizard® 4 NanoScience Rasterkraftmikroskop vor (engl. AFM - Atomic Force Microscope), das neueste System der marktführenden NanoWizard®-AFM-Reihe.

JPK Instruments stellt das neueste seiner NanoWizard®-AFM-Systeme vor und bringt damit das weltweit flexibelste Rasterkraftmikroskop auf den Markt, das NanoWizard® 4 NanoScience AFM. JPK präsentiert seinen Kunden damit erneut ein wegweisendes System mit hoher technischer Leistungsfähigkeit und spannenden Neuerungen. Es verfügt über eine leistungsstarke Fastscanning-Option, mit der Aufnahmen in 3 Sekunden möglich sind, um dynamische Prozesse zu verfolgen. Mit JPKs einzigartigen sog. Quantitative Imaging Modus (QI™ Mode) ist quantitativer Bildgebung mit außergewöhnlich hoher Auflösung möglich.

JPK hat es sich zu Aufgabe gemacht, seinen Kunden einfach und intuitiv zu bedienende Bildgebungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, mit mehr Abbildungsmodi und Zubehör als jedes andere AFM-System auf dem Markt. Das NanoWizard® 4 NanoScience AFM bietet einzigartige Lösungen für die Charakterisierung mechanischer und elektrischer Probeneigenschaften und liefert flexible und fortschrittliche Herangehensweisen für die zunehmend komplexen Herausforderungen, denen sich Materialwissenschaftler heutzutage stellen müssen. Das System beinhaltet den leistungsstarken digitalen Vortis™-Controller, der atomare Auflösung und hohe Scan-Geschwindigkeiten mit einer einzigen Plattform möglich macht. JPKs QI™ Mode basiert auf echten Kraftkurven und misst Kräfte mit unerreicht hoher Empfindlichkeit. So behält der Nutzer selbst bei zerbrechlichen, empfindlichen, weichen oder klebrigen Proben die Kontrolle. Mit der bewährten Ultra-Speed-Scannertechnologie kann ein Bereich von 100µm x 100µm in 3 Sekunden aufgenommen werden, das ist 30 mal schneller als jedes andere kommerziell erhältliche AFM.

Immer mehr Kunden möchten die Produktivität steigern und Langzeitexperimente uneingeschränkt verfolgen. JPK reagiert auf diese Nachfrage mit einer erweiterten Bedienbarkeit und Remote-Control-Funktionen. Mit dem neuen ExperimentControl™-Softwarepaket kann der Kunde Experimente über das Internet mit dem PC, Tablet oder Smartphone vorbereiten und steuern. So werden Daten in Echtzeit geliefert und dem Kunden rund um die Uhr ein uneingeschränkter Zugang ermöglicht.

Die neue CryoStage erlaubt dem Nutzer im Gegensatz zu gängigen AFM Systemen bei Raumtemperatur eine Temperaturkontrolle zwischen -120°C und 200°C. Mit der neuen StretchingStage kann die Probe einer externen mechanischen Belastung ausgesetzt werden, während das AFM in-situ Veränderungen der Probeneigenschaften misst. Zusätzlich sind die Module und Abbildungsmodi für elektrische Messungen wie Conductive AFM (CAFM), Electrical Force Microscopy (EFM) und Kelvin Probe AFM (KPM-AFM) weiter ausgebaut worden.

Das NanoWizard® AFM System von JPK ist eine einzigartige Plattform, die ständig erweitert wird, um den zunehmenden Anforderungen in den Nanowissenschaften gerecht zu werden. Das NanoWizard® 4 NanoScience AFM ist die neueste Lösung aus dieser Reihe - entwickelt, um schon jetzt Antworten auf die modernen und komplexen Fragen der Forschung von morgen zu finden.

JPK Instruments entwickelt, konstruiert und fertigt Instrumente in Deutschland zu weltweit anerkannten Standards der deutschen Feinmechanik, Qualität und Funktionalität. Für weitere Einzelheiten über das NanoWizard® AFM und Zubehör, sowie weitere Produkte besuchen Sie uns auf der JPK Webseite www.jpk.com, YouTube, Facebook oder LinkedIn.

Anlage:



Das neue NanoWizard® 4 NanoScience Rasterkraftmikroskop von JPK Instruments.

Kontakt:

Dr. Gabriela Bagordo
tel: + 49 30 5331 12070
fax: +49 30 5331 22555
bagordo@jpk.com

JPK Instruments AG
Bouchéstrasse 12
12435 Berlin
www.jpk.com

Über JPK Instruments AG

JPK Instruments AG ist ein weltweit führender Hersteller von Nanoanalytik-Instrumenten, insbesondere von rasterkraftmikroskopischen Systemen (AFM) und optischen Pinzetten (Optical Tweezers), mit einem breiten Anwendungsspektrum von der Soft Matter Physik bis zur Nanooptik, von der Oberflächenchemie bis hin zur Zell- und Molekularbiologie. Als Experte in der Technologie der Rasterkraftmikroskopie hat JPK mit als erstes die bahnbrechenden Möglichkeiten der Nanotechnologie auf den Gebieten der Life Sciences und der Soft Matter erkannt. Durch Innovationsgeist, durch Spitzentechnologie und eine einzigartige Applikationsexpertise hat JPK die Nanotechnologie erfolgreich mit den Life Sciences zusammengeführt. JPK hat seinen Hauptsitz in Berlin sowie weitere Standorte in Dresden (Deutschland), Cambridge (UK), Singapur, Tokio (Japan), Shanghai (China), Paris (Frankreich) und Carpinteria (USA). Mit seinem globalen Vertriebsnetz und mehreren Support Centern betreut JPK die kontinuierlich wachsende Zahl von Anwendern mit ganzheitlichen Lösungen und erstklassigem Service direkt vor Ort.